СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ

работников АО «НИИМЭ» и ОАО «НИИМЭ и Микрон» в 2015г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Дата | Автор (ы)выступающий | Название /тема | Издание/мероприятие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2015г. (+)ВАК | *Шелепин Н.А.* | «Физические основы моделирования паразитных элементов КНИ КМОП». | Журнал «Нано- и микросистемная техника» - 2015. - № 5. - С. 9-16 |
| 2 | 2015г. (+) | *Бенедиктов А.С.,* *Игнатов П.В.* | «Исследование работы МОП-транзисторов на структурах КНИ с проектными нормами 0,5 мкм в диапазоне температур от 0 до 250 °С» | Тезисы доклада на Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов -2015», 13-17 апреля 2015г, с.57 |
| 3 | 2015г. (+)ВАК | *Бенедиктов А.С.,* *Егорова Т.Ю.,**Игнатов П.В.,* *Ключников А.С.,* *Смирнов А.Н.* | «Исследование работы МОП-транзисторов на структурах кремний на изоляторе при высоких температурах» | Журнал: «Нано- и микросистемная техника» № 6 (179), 2015, стр. 53-59 |
| 4 | 2015г. (+)ВАК | *Красников Г.Я., Бокарев В.П.* | «Поверхностное плавление кристаллов и спекание порошкообразных веществ» | Журнал – «Поверхность. Рентгеновские, синхронные и нейронные исследования», 2015, №10, с.109-112 |
| 5 | 2015г. (+) | *Дианов А.М.* (Микрон) | «Эльбрус» российский на все сто» | Журнал «Интеллект & Технологии» №1 -2015г. стр. 72 |
| 6 | 2015г. (+) | *Панасюк В.Н.* | «Интегрированное управление рисками в ОАО «НИИМЭ и Микрон» | Журнал - «Методы менеджмента качества» № 4 2015г. стр. 10-15  |
| 7 | 2015г. (+)ВАК | *Ильин С.А.* | «Выбор базовых схемотехнических решений для проектирования библиотек цифровых ячеек» | Журнал- «Электроника. Известие вузов», 2015, том 20, № 1, стр.44-49 |
| 8 | 2015г. (+) | *Панасюк В.Н.* | «Особенности работы с жалобами иностранных потребителей в ОАО «НИИМЭ и Микрон» | Журнал - «Методы менеджмента качества» № 5 2015г. стр. 12-17  |
| 9 | 2015г. (+)ВАК | *Красников Г.Я., Гущин О.П.,**Морозов А.Д., Игнатов П.В., Горнев Е.С., Каширин П.А., Овчинников В.А.,* *Базанов Д.В.,* *Орликовский Н.А.,* *Кальнов В.А.* | « Использование CAR- резистов в электронно-лучевой литографии» | Журнал: Электронная техника. Серия 3. Микроэлектроника № 1 (157), 2015г.,Стр. 41-48 |
| 10 | 2015г. (+)ВАК | *Резванов А.А., Гущин О.П.,**Горнев Е.С., Красников Г.Я.,* *Могильников К.П., Л Чанг., Ж.-Ф. де Марнефф,* *К. Дюссаррат, М.Р. Бакланов* | «Изобары адсорбции фторуглеродных соединений, выбранных для криогенного плазменного травления LOW-K диэлектриков» | Журнал: Электронная техника. Серия 3. Микроэлектроника № 1 (157), 2015г.,Стр. 49-57 |
| 11 | 2015г. (+) | *Эннс В.И.,* *Темирбулатов М.С.* | «Космическая программа и радиационная стойкость современных интегральных микросхем» | Тезисы доклада 18 Всероссийской научно-технической конференции «Радиационная стойкость электронных систем» («Стойкость-2015») , с.121 |
| 12 | 2015г. (+) | *Измайлов Р.А., Орлов О.М.* | «Математическая модель функционирования МОНОП элемента памяти» | Тезисы доклада на Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов -2015», 13-17 апреля 2015г, с.59-60 |
| 13 | 2015г. (+)ВАК | *Красников Г.Я.,* *Мещанов В.Д.,* *Шелепин Н.А.* | «Семейство КНИ микросхем ПЗУ информационной емкостью 4-64 мбит для аэрокосмических применений» | Журнал: Электронная техника. Серия 3. Микроэлектроника, № 2 (158), 2015г., стр. 4-12 |
| 14 | 2015г. (+)ВАК | *Бокарев В.П., Горнев Е.С., Кирюшина И.В., Ранчин С.О., Трусов А.А.* | «О жидкостной химической очистке пластин перед проведением термических операций» | Журнал: Электронная техника. Серия 3. Микроэлектроника № 1 (157), 2015г.,Стр. 25-32 |
| 15 | 2015г. (+) | *Бурдин Ю.С., Панасюк В.Н., Спирин А.И., Сумбулян В.В.* | «Создание системы энергетического менеджмента и ее роль в развитии предприятия» | Журнал - «Методы менеджмента качества» № 6 2015г. стр. 4-10  |
| 16 | 2015г. (+)ВАК | *Лосевской А.Ю.* | «Исследование физически неклонируемых функций на основе статической памяти» | Журнал- «Электроника. Известие вузов», том 21, № 1, 2016г., стр.61-66 |
| 17 | 2015г. (+)ВАК | *Горнев Е.С., Матюшкин И.В., Теплов Г.С.* | «Анализ концепций неклассического компьютинга и парадигмы коннекционизма» | Журнал: Электронная техника. Серия 3. Микроэлектроника № 2 (158), 2015г.,Стр. 45-66 |
| 18 | 2015г. (+)ВАК | *Гущин О.П. ,Валеев А.С., Чамов А.А., Мицын Н.Г., Долгополов В.М.,* *Одиноков В.В.,* *Немировский В.Э.,* *Иракин П.А.* | «Разработка оборудования и исследование технологии глубокого травления кремния» | Журнал – «Электронная техника. Серия 3. Микроэлектроника» № 3 (159), 2015г., стр. 50-54 |
| 19 | 2015г. (+) | *Баранов Г.В., Итальянцев А.Г., Красников Г.Я.* | «Физические особенности и конструкции низкоразмерных транзисторных структур» | Тезисы доклада конференции: «Микроэлектроника-2015» Интегральные схемы и микроэлектронные модули – проектирование, производство и применение», 28 сентября – 3 октября 2015г., Крым, Алушта, стр.267-268 |
| 20 | 2015г. (+) | *Гвоздев В.А., Кузнецов П.И., Валеев А.С.* | «Локальное формирование медных проводников шириной 90 нм» | Тезисы доклада конференции: «Микроэлектроника-2015» Интегральные схемы и микроэлектронные модули – проектирование, производство и применение», 28 сентября – 3 октября 2015г., Крым, Алушта, стр.275-277 |
| 21 | 2015г. (+) | *Резванов А.А., Гущин О.П., Могильников К.П.,* *Горнев Е.С., Красников Г.Я., Руденко К.В., Бакланов М.Р.* | «Исследование повреждений low-k диэлектриков при криогенном травлении» | Тезисы доклада конференции: «Микроэлектроника-2015» Интегральные схемы и микроэлектронные модули – проектирование, производство и применение», 28 сентября – 3 октября 2015г., Крым, Алушта, стр.263-265 |
| 22 | 2015г. (+) | *Гущин О.П., Валеев А.С., Чамов А.А., Мицын Н.Г., Долгополов В.М.,* *Одиноков В.В.,**Немировский В.Э.* *Иракин П.А.* | «Исследование и технология глубокого травления кремния» | Тезисы доклада конференции: «Микроэлектроника-2015» Интегральные схемы и микроэлектронные модули – проектирование, производство и применение», 28 сентября – 3 октября 2015г., Крым, Алушта, стр.278-280 |
| 23 | 2015г. (+) | *Бенедиктов А.С.,* *Игнатов П.В., Горнев Е.С.* | «Компьютерное моделирование и экспериментальные исследования функционирования КНИ МОП-транзисторов при высоких температурах» | Тезисы доклада конференции: «Микроэлектроника-2015» Интегральные схемы и микроэлектронные модули – проектирование, производство и применение», 28 сентября – 3 октября 2015г., Крым, Алушта, стр. 265-266 |
| 24 | 2015г. (+) | *Бурякова Т.Л., Горнев Е.С., Гущин О.П., Данила А.В., Бенедиктов А.С., Поляков А.Н.* | «Тримминг фоторезистивной маски в технологии 90 нм для формирования 65 нм затвора» | Тезисы доклада конференции: «Микроэлектроника-2015» Интегральные схемы и микроэлектронные модули – проектирование, производство и применение», 28 сентября – 3 октября 2015г., Крым, Алушта, стр.261-262 |
| 25 | 2015г. (+) | *Кузнецов П.И., Гвоздев В.А., Валеев А.С.* | «Формирование медной металлизации с ultra low-k диэлектриком» | Тезисы доклада конференции: «Микроэлектроника-2015» Интегральные схемы и микроэлектронные модули – проектирование, производство и применение», 28 сентября – 3 октября 2015г., Крым, Алушта, стр.277-278 |
| 26 | 2015г. (+)ВАК | *Захаров П.С.,* *Итальянцев А.Г.* | «Эффект переключения электрической проводимости в структурах металл-диэлектрик-металл на основе нестехиометрического оксида кремния» | Журнал - «Труды МФТИ» — 2015, Том 7, № 2, с.113-118 |
| 27 | 2015г. (+) | *Захаров П.С.,* *Итальянцев А.Г.,* *Красников Г.Я.* | «Элементы резистивной памяти на основе нестехиометрического оксида кремния» | Тезисы доклада конференции: «Микроэлектроника-2015» Интегральные схемы и микроэлектронные модули – проектирование, производство и применение», 28 сентября – 3 октября 2015г., Крым, Алушта, стр.268-269 |
| 28 | 2015г. (+) | *Нуйкин А.В., Кравцов А.С.* | «Перспективы развития систем радиочастотной идентификации на основе карт памяти и микропроцессорных карт» | Тезисы доклада конференции: «Микроэлектроника-2015» Интегральные схемы и микроэлектронные модули – проектирование, производство и применение», 28 сентября – 3 октября 2015г., Крым, Алушта, стр.112-114 |
| 29 | 2015г. (+) | *Ильин С.А., Кочанов С.К., Ласточкин О.В., Новиков А.А.* | «Методика автоматизированного поиска архитектуры базовых конструктивов защиты от ЭСР» | Тезисы доклада конференции: «Микроэлектроника-2015» Интегральные схемы и микроэлектронные модули – проектирование, производство и применение», 28 сентября – 3 октября 2015г., Крым, Алушта, стр.135-137 |
| 30 | 2015г. (+) | *Орлов С.Н., Горнев Е.С., Яфаров Р.К., Яфаров А.Р., Тимошенков В.П.,* *Жигалов В.А.* | «Матричные углеродные катоды на кремниевых пластинах». | Тезисы доклада конференции: «Микроэлектроника-2015» Интегральные схемы и микроэлектронные модули – проектирование, производство и применение», 28 сентября – 3 октября 2015г., Крым, Алушта, стр.272-273 |
| 31 | 2015г. (+) | *Эннс В.И.* | «Разработки ОАО «НИИМЭ и Микрон» для применения в аппаратуре РКТ» | Тезисы доклада конференции: «Микроэлектроника-2015» Интегральные схемы и микроэлектронные модули – проектирование, производство и применение», 28 сентября – 3 октября 2015г., Крым, АлуштаСтр. 57-59 |
| 32 | 2015г. (+)ВАК | *Лосевской А.Ю.* | «Влияние напряжения питания на характеристики физики не клонируемых функций арбитрового типа» | Журнал «Инженерный вестник Дона»№3 (2015) |
| 33 | 2015г. (+)ВАК | *Захаров П.С.,* *Итальянцев А.Г.* | «Эффект резистивного переключения в структурах памяти на основе оксида кремния» | Журнал: Электронная техника. Серия 3. Микроэлектроника № 3 (159), 2015г, стр.5-10 |
| 34 | 2015г. (+) | *Шелепин Н.А.* | «Технологический баланс ОАО «НИИМЭ и Микрон» для реализации изделий космического назначения». | Тезисы доклада конференции: «Микроэлектроника-2015» Интегральные схемы и микроэлектронные модули – проектирование, производство и применение», 28 сентября – 3 октября 2015г., Крым, АлуштаСтр.55-57 |
| 35 | 2015г. (+) | *Шелепин Н.А.* | «Особенности суб-100-нанометровых технологий СБИС и их реализация в ОАО «НИИМЭ и Микрон» | Тезисы доклада конференции: «Микроэлектроника-2015» Интегральные схемы и микроэлектронные модули – проектирование, производство и применение», 28 сентября – 3 октября 2015г., Крым, АлуштаСтр.17-19 |
| 36 | 2015г. (+) | *Итальянцев А.Г.,* *Константинов В.С.*  | «Акустический метод недеструктивного считывания в сегнетоэлектрической памяти» | Тезисы доклада конференции: «Микроэлектроника-2015» Интегральные схемы и микроэлектронные модули – проектирование, производство и применение», 28 сентября – 3 октября 2015г., Крым, АлуштаСтр. 280-281 |
| 37 | 2015г. (+) | *Теплов Г.С., Матюшкин И.В., Горнев Е.С.* | «Принципы повышения наработки до отказа схем управления на основе клеточно-автоматных и нейроподобных структур» | Тезисы доклада конференции: молодых специалистов Госкорпорации «Росатом»Нижний НовгородОпубликовано в журнале «Россия – Атомный проект», № 22, стр.48-49 |
| 38 | 2015г. (+) | *Бенедиктов А.С.,* *Игнатов П.В.* | «Моделирование работы МОП-транзисторов на структурах КНИ при высоких температурах» | Доклад на конференции: молодых специалистов Госкорпорации «Росатом»Нижний Новгород, Опубликовано в журнале «Россия – Атомный проект», № 22, стр.50-51 |
| 39 | 2015г. (+) | *Красников Г.Я.,* *Кирюшина И.В., Егоров А.А., Ранчин С.О., Горнев Е.С.* | «Проблема переосаждения кобальта при формировании спейсера» | Тезисы доклада конференции: «Микроэлектроника-2015» Интегральные схемы и микроэлектронные модули – проектирование, производство и применение», 28 сентября – 3 октября 2015г., Крым, АлуштаСтр.295-297 |
| 40 | 2015г. (+)ВАК | *Андреев Д.А., Копцев Д.А.* | «Моделирование и методика измерения монолитных интегральных схем приемного тракта на основе SiGe гетеробиполярных транзисторов для диапазона частот 57-64 ГГц» | Журнал: Электронная техника. Серия 3. Микроэлектроника № 3 (159), 2015г.,Стр. 67-70 |
| 41 | 2015г. (+)ВАК | *G. Ya. Krasnikov and* *V. P. Bokarev* | «Surface Melting of Crystals and the Sintering of Powders» | Journal of Surface Investigation. X\_ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 2015, Vol. 9, No. 5, pp. 1116–1119. |
| 42 | 2015г. (+) | *Бенедиктов А.С.,*  *Игнатов П.В.,**Горнев Е.С.* | «Компьютерное моделирование и экспериментальные исследования функционирования КНИ МОП - транзисторов при высоких температурах» | Сборник трудов конференции: «Микроэлектроника-2015» «Интегральные схемы и микроэлектронные модули – проектирование производство и применение», 28 сентября – 3 октября 2015г., Крым, АлуштаСтр.265-266 |
| 43 | 2015г. (+) | *Бенедиктов А.С.,* *Игнатов П.В.* | «Особенности работы радиационностойких КНИ МОП - транзисторов при температурах окружающей среды > 125°С» | Сборник трудов конференции: МФТИ -58 |
| 44 | 2015г. (+) | *Новиков А.А., Ильин С.А., Кочанов С.К.,* *Ласточкин О.В.* | «Модифицированный маршрут автоматизированного поиска структур схем статической и динамической защиты СБИС от электростатического разряда» | Сборник трудов конференции: «Электроника-2015», 19-20 ноября 2015г, Зеленоград, МИЭТ, Стр. 56 |
| 45 | 2015г. (+) | *Яфаров Р.К., Горнев Е.С., Орлов С.Н.,* *Тимошенков С.П.,**Тимошенков В.П.,* | «Метод формирования автоэмиссионных эмиттеров с использованием микроволнового плазмохимического синтеза наноуглеродных структур» | Сборник тезисов докладов конференции: Международная научно-техническая конференция, «Электроника-2015», 19-20 ноября 2015г, Зеленоград, МИЭТ, стр.48 |
| 46 | 2015г. (+)ВАК | *Зайцев Н.А., Бокарев В.П., Плотников Ю.И.* | «Вопросы надежности современных ИС» | Журнал: Электронная техника. Серия 3. Микроэлектроника № 3 (159), 2015г.,Стр. 71-76 |
| 47 | 2015г. (+) | *Антюфриева Л.А.,* *Михеев Р.С.,**Кирилихина М.А.* | «Разработка и исследование высокоскоростного АЦП с емкостной интерполяцией». | Сборник трудов конференции«58 научная конференция МФТИ»,Московский физико-технический институт(ТУ), г.Москва23 ноября 2015 - 28 ноября 2015, |
| 48 | 2015г. (+) | *Резванов А.А.,* *Матюшкин И.В., Гущин О.П.* | «Клеточно-автоматная модель воздействия кислород-содержащей плазмы на макроскопическую диэлектрическую проницаемость пористого SiOCH диэлектрика» | Сборник трудов конференции«58 научная конференция МФТИ»,Московский физико-технический институт(ТУ), г. Москва23 ноября - 28 ноября 2015, |
| 49 | 2015г. (+) | *Rezvanov Askar,* *Matyushkin Igor V,* *Gutshin Oleg P.* | «Cellular automata model of O2 plasma treatment influence on the integral properties of SiOCH low- K dielectric» | Сборник тезисов конференции«PESM-2015, Leuven, Belgium»27 апреля 2015-28 апреля 2015, |
| 50 | 2015г. (+) | *Rezvanov Askar, Gutshin Oleg P., Gornev Evgeny S., Krasnikov Gennady Ya, Mogilnikov Konstantin P., Zhang Liping, de Marneeffe Jean-Francois, Dussarrat Christian, Baklanov Mikhail R.* | «Temperature measurements of thin porous low-k films at adsorption fluorocarbon compounds selected for cryogenic etching» | Сборник тезисов конференции«PESM-2015, Leuven, Belgium»27-28 апреля 2015 |
| 51 | 2015г. (+) | *Rezvanov Askar, Mogilnikov Konstantin P., Gutshin Oleg P., Gornev Evgeny S., Krasnikov Gennady Ya, Zhang Liping, Dussarrat Christian, de Marneeffe Jean-Francois, Baklanov Mikhail R.* | «Adsorption isobars of fluorocarbon compounds selected for cryogenic plasma etching of low-k dielectrics» | Сборник тезисов конференции«MRS 2015 Spring meeting & exhibit»San Francisco, California06 апреля-10 апреля 2015 |
| 52 | 2015г. (+)ВАК | *Бенедиктов А.С.* | «Обзор конструктивно-технологических решений, используемых при разработке высокотемпературных транзисторов на структурах кремний на изоляторе» | Журнал: Электронная техника. Серия 3. Микроэлектроника, № 3 (159), с.77-81 |
| 53 | 2015г. (+)ВАК | *Алексеев М.Н., Зайцев В.В., Нидеккер Л.Г., Эннс В.И.* | «Метод верификации RTL описаний цифровых схем, тактируемых несколькими синхросигналами». | Журнал: Электронная техника. Серия 3. Микроэлектроника, выпуск 3 (159), стр.55-59, Москва,2015г. |
| 54 | 2015г. (+)ВАК | *Атамась Д.А., Копцев Д.А., Селецкий А.В., Панышев К.А., Шелепин Н.А.* | «Моделирование влияния ТЗЧ на работу СВЧ СФБ, изготовленных по КМОП КНИ технологии» | Журнал: Электронная техника. Серия 3. Микроэлектроника № 3 (159), 2015г.,Стр. 60-66 |
| 55 | 2015г. (+) | *Орлов О.М.* | «Особенности разработки элементов энергонезависимой памяти FRAM, ReRAM на основе использования процессов ALD» | Сборник тезисов докладов конференции: Международная научно-техническая конференция, «Электроника-2015», 19-20 ноября 2015г, Зеленоград, МИЭТ, Стр. 45-46 |
| 56 | 2015г. (+) | *Измайлов Р.А., Орлов О.М.* | «Моделирование режимов работы элемента памяти на основе слоя нитрида кремния» | Сборник тезисов докладов конференции«58 научная конференция МФТИ»,Московский физико-технический институт (ТУ), г. Москва23 ноября 2015 - 28 ноября 2015, |
| 57 | 2015г. (+) | *O.M. Orlov, G.Ya. Krasnikov, V.A. Gritsenko, V.N. Kruchinin, T.V. Perevalov, V.Sh. Aliev, D.R. Islamov, I.P. Prosvirin* | « Nanoscale Potential Fluctuation in Non-Stoichiometric Hafnium Suboxides» | Тезисы доклада на Symposium «Semiconductors, Dielectrics, and Metals for Nanoelectronics 13», held during the 228 th meeting of The Electrochemical Society, in Phoenix, AZ, from October 11 to October 15, 2015, c. 237-241  |
| 58 | 2015г. (+)ВАК | *Орлов О.М., Маркеев А.М., Зенкевич А.В., Егоров К.В., Черникова А.Г.* | «Исследование особенностей элементов энергонезависимой памяти FRAM и ReRAM, полученных с использованием метода атомно-слоевого осаждения» | Журнал: «Электронная техника. Серия 3. Микроэлектроника», выпуск 4(160), 2015г. стр.62-68 |
| 59 | 2015г. (+)ВАК | *Орлов О.М., Красников Г.Я., Морозов Е.Н., Гриценко В.А., Исламов Д.Р.* | «Механизм транспорта электронов и привода ловушек в тонких слоях термического оксида на кремнии после протекания заряда» | Журнал: «Электронная техника. Серия 3. Микроэлектроника», выпуск 4(160), 2015г. стр.52-61 |
| 60 | 2015г. (+)ВАК | *Г. Я. Красников,* *Н. А. Зайцев,* *А. Г. Красников* |  «Современное состояние разработок в области энергонезависимой памяти»  |  Нано- и микросистемная техника. - 2015. – № 4. - С. 60-64 |
| 61 | 2015г. (+) | *Матюшкин И.В..,* *Теплов Г.С., Горнев Е.С.* | «Особенности реализации микросхем с клеточно-автоматной архитектурой на основе эффекта резистивного переключения» | Сборник тезисов конференции «Электроника-2015», 19-20 ноября 2015г, Зеленоград, МИЭТ, стр.51-52 |
| 62 | 2015г. (+)ВАК | *Захаров П.С.,* *Итальянцев А.Г.* | «Математическое моделирование распределения температуры в ячейке резистивной памяти на основе оксида кремния» | Журнал: «Электронная техника. Серия 3. Микроэлектроника», выпуск 4(160), 2015г. стр.69-72 |
| 63 | 2015г. (+)ВАК | *Просий А.Д., Ранчин С.О., Шелепин Н.А.* | «Обеспечение качества в современном полупроводниковом производстве» | Журнал: «Электронная техника. Серия 3. Микроэлектроника», выпуск 4(160), 2015г. стр.39-43 |